

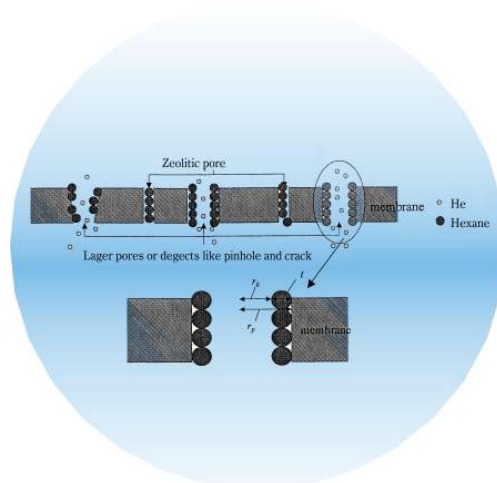
分離膜欠陥構造解析装置

Porometer nano



原理

ゼオライト分離膜への水・ヘキサン・四塩化炭素の蒸気の毛管凝縮 (Kelvin式) を利用し、キャリアガスの透過量からゼオライト膜の細孔構造を分析する。



特徴

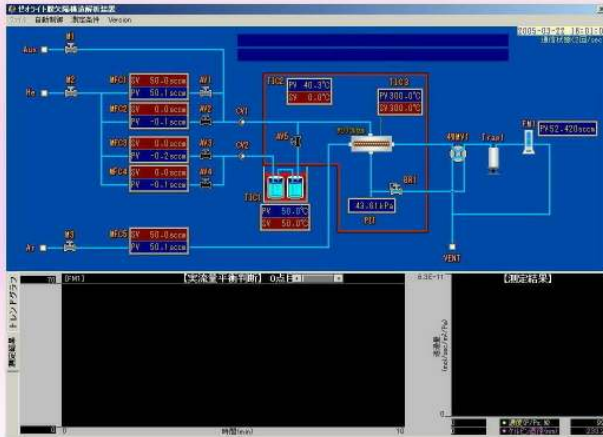
- ✓ コンピューターによる自動測定
- ✓ 細孔構造および吸着層の補正が可能
- ✓ 水銀を使用しない常圧における非破壊測定



BEL JAPAN, INC.

アプリケーション

- ✓ ゼオライト分離膜
- ✓ 中空糸
- ✓ フィルター



仕様

- ◆ 測定可能蒸気 : 水、エタノール、ヘキサン、四塩化炭素
- ◆ 相対蒸気設定範囲 : 0.2~80 %
- ◆ 測定温度 : 30~60 °C
- ◆ 細孔径測定範囲 : 0.55~20 nm (Kelvin 直径)
- ◆ 電源 : AC100V 30A
- ◆ 装置サイズ : W 760×D 500×H 800

日本ベル株式会社

本社・西日本営業所 大阪府豊中市原田中1-9-1

TEL 06-6841-2161 FAX 06-6841-2767

E-mail osk@nippon-bel.co.jp

東京支店 東京都墨田区緑2-7-3 タワビル4階

TEL 03-5638-4271 FAX 03-5638-4277

E-mail tok@nippon-bel.co.jp

URL <http://www.nippon-bel.co.jp/>

Reference

- 1) F.P. Cuperus, D. Bargeman and C.A. Smolders, *J. Membrane Sci.*, **71** (1992) 57.
- 2) R. Gallaher and P.K.T. Liu, *J. Membrane Sci.*, **92** (1994) 29



BEL JAPAN, INC.